

数字集成电路与嵌入式内核系统可测试性设计

作者：（美）阿尔弗雷德著

出版日期：2004.01

总页数：348

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11195609.html>）查找全本
阅读方式

数字集成电路与嵌入式内核系统可测试性设计 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11195609.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11195609.html>

书名：数字集成电路与嵌入式内核系统可测试性设计